

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande No  
PCT/FR 03/01895

## A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 7 G01N21/21 G01J4/00 G01B11/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 G01N G01J G01B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

## C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	GB 2 352 030 A (IBM) 17 janvier 2001 (2001-01-17) page 3, ligne 41 -page 4, ligne 19 page 8, ligne 27-42 ---	1-3
A	US 5 333 052 A (FINAROV MOSHE) 26 juillet 1994 (1994-07-26) colonne 2, ligne 13-68 colonne 4, ligne 1-5 colonne 4, ligne 42 -colonne 8, ligne 6 colonne 11, ligne 53-68 ---	1-3
A	GB 2 291 890 A (ANELVA CORP ;NIPPON ELECTRIC CO (JP)) 7 février 1996 (1996-02-07) abrégé colonne 13, ligne 9-14 ---	1-3
	-/--	

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

### \* Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- \*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- \*X\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- \*Y\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- \*Z\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

5 novembre 2003

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

13/11/2003

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Verdrager, V

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No  
PCT/FR 03/01895

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	<p>DICKE J ET AL: "Ellipsomicroscopy for surface imaging: contrast mechanism, enhancement, and application to CO oxidation on Pt(110)" JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA - A, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, WASHINGTON, US, vol. 17, no. 1, janvier 2000 (2000-01), pages 135-141, XP002182387 ISSN: 1084-7529 page 137, alinéa 1</p>	1-3
A	<p>DE 197 08 036 A (ELENDER GUNTHER DR ;MERKEL RUDOLF DR (DE); NEUMAIER KLAUS DIPL PHY) 10 septembre 1998 (1998-09-10) colonne 2, ligne 60 -colonne 3, ligne 6 colonne 5, ligne 12-22 colonne 6, ligne 21-54</p>	1-3
A	<p>SHATALIN S V ET AL: "Polarisation contrast imaging of thin films in scanning microscopy" OPTICS COMMUNICATIONS, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, NL, vol. 116, no. 4, 1 mai 1995 (1995-05-01), pages 291-299, XP004011523 ISSN: 0030-4018 page 292, colonne 2, alinéa 3 page 294, colonne 1, alinéa 2</p>	1-4,8
A	<p>US 5 408 322 A (HSU JON S ET AL) 18 avril 1995 (1995-04-18) colonne 9, ligne 40-45 colonne 11, ligne 28-31</p>	1-3

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale

PCT/FR 03/00055

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
GB 2352030	A	17-01-2001	US 6453263 B1	17-09-2002
US 5333052	A	26-07-1994	IL 96483 A	31-07-1995
			EP 0563221 A1	06-10-1993
			JP 2702281 B2	21-01-1998
			JP 6504843 T	02-06-1994
			WO 9209880 A2	11-06-1992
GB 2291890	A	07-02-1996	JP 2648098 B2	27-08-1997
			JP 8045851 A	16-02-1996
			KR 152369 B1	01-12-1998
			US 5793479 A	11-08-1998
DE 19708036	A	10-09-1998	DE 19708036 A1	10-09-1998
US 5408322	A	18-04-1995	AU 6266794 A	21-11-1994
			CA 2159831 A1	10-11-1994
			DE 69423212 D1	06-04-2000
			DE 69423212 T2	07-09-2000
			EP 0696345 A1	14-02-1996
			JP 2969950 B2	02-11-1999
			JP 8509810 T	15-10-1996
			WO 9425823 A1	10-11-1994